

Sintesi della consultazione preliminare di mercato per l'acquisto di un nuovo microscopio elettronico a scansione (S.E.M.)

A seguito dell'avviso 49-2017 pubblicato sul sito dell'Agenzia "Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di un microscopio elettronico a scansione (SEM) dotato di microanalisi EDS", sono pervenute le manifestazioni d'interesse da parte di tre ditte fornitrici. Nelle giornate del 06/10/17 e del 13/10/17 si sono svolti gli incontri di consultazione.

In particolare, in data 06/10/17, è stata presentata la gamma di prodotti Tescan (ditta della Repubblica Ceca), proposti da Assing (rivenditore italiano, era presente il Dr. Casati). I modelli presentati sono stati i microscopi ad emissione di campo (FEG) modello Mira (base) e Maia (top di gamma). Valutate le prestazioni, il personale del Polo Amianto ha richiesto maggiori dettagli sul modello Mira, con camera media, detectors di elettroni secondari in colonna e in camera, detector di elettroni retrodiffusi (e altre caratteristiche presenti nella brochure dedicata).

In data 13/10/2017, si sono effettuati gli incontri con le ditte Jeol e Zeiss, in orari differenti, consecutivi.

Nello specifico, il Dr. Grianti per Jeol, ditta giapponese con sede e magazzino anche a Milano, ha presentato il SEM termoionico modello JSM- IT500 (luglio 2017), con sorgente al tungsteno (fire unit pre-centrata), tavolino eucentrico, EDS Jeol per la microanalisi con acquisizione in continuo e una serie di accessori visionabili nella brochure dedicata. In alternativa, la stessa configurazione è stata associata alla sorgente ad emissione di campo (gamma FEG-Jeol). Nell'incontro con Zeiss, azienda multinazionale nata in UK e rappresentata dal Dr. Lombardo, sono stati descritti i prodotti della serie EVO (SEM termoionico) e della serie SIGMA (FEG). In particolare è stato presentato il modello EVO-10, con beam sleeve per applicazioni in basso vuoto e il software di Auto Intelligent Imaging (A.I.I.) per le analisi in automatico, compresi nella fornitura. Il modello SIGMA 300 è stato proposto con i detectors di elettroni secondari in colonna e in camera, detector di elettroni retrodiffusi e A.I.I. Per entrambi gli strumenti sono visionabili maggiori dettagli sui cataloghi on line.

Nel corso di tutti gli incontri sono state fornite informazioni su strumentazione anche di fascia superiore.

07.12.2017

Il Dirigente responsabile della Struttura
Semplice acquisti beni e servizi
(Dr.ssa Rossana Maria Caterina Giannone)


